



用于晶片级器件辐射效应试验的X射线辐照测试设备

李豫东^{*}; 于新; 于刚; 文林^{*}; 何承发^{*}; 郭旗^{*}

2016-12-07

专利权人

中国科学院新疆理化技术研究所

专利类型

发明专利

摘要

本发明涉及用于晶片级器件辐射效应试验的X射线辐照测试设备, 该设备是由X射线辐照装置、显微成像装置、探针台、冷却与空气循环装置、辐射测量装置、控制与测试分系统、框架、水平导轨、高压程控电源、X射线控制器、UNIDOS剂量仪、控制计算机、半导体参数测试仪、示波器和矩阵开关组成, 该设备实现晶片级器件的辐照与在线辐射效应参数提取及实时监测; 并实现辐照测试的一体化、操作的自动化, 可显著提高辐照与测试的稳定性与效率。该设备直接对晶片级器件进行试验, 摒除了器件封装材料、封装结构、引线及封装过程引入的一些不确定因素的影响, 可显著降低参数提取的偏差; 消除了辐照、测试环境交替以及测试时间延迟给试验结果带来的影响。

申请日期

2016-07-04

申请号

CN201610516216.2

公开(公告)号

CN106199372A

代理机构

乌鲁木齐中科新兴专利事务所 65106

文献类型

专利

条目标识符

http://ir.tianshanzw.cn/handle/365002/6549

专题

固体辐射物理研究室

推荐引用方式

李豫东, 于新, 于刚, 等. 用于晶片级器件辐射效应试验的X射线辐照测试设备. CN106199372A[P]. 2016-12-07.

GB/T 7714



条目包含的文件

条目无相关文件。

所有评论 (0)

[发表评论/异议/意见]

暂无评论

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

个性服务

推荐该条目

★ 保存到收藏夹

🔍 查看访问统计

📄 导出为Endnote文件

谷歌学术

📖 谷歌学术中相似的文章

📖 [李豫东]的文章

📖 [于新]的文章

📖 [于刚]的文章

百度学术

📖 百度学术中相似的文章

📖 [李豫东]的文章

📖 [于新]的文章

📖 [于刚]的文章

必应学术

📖 必应学术中相似的文章

📖 [李豫东]的文章

📖 [于新]的文章

📖 [于刚]的文章

相关权益政策

暂无数据

收藏/分享

